

設備利用研修会「蛍光X線分析装置によるマッピング測定」

物質にX線を当てたときに発生する蛍光X線を測定することで
元素分析ができる装置です。

この装置を利用したマッピング測定について、職員が実演しながらご説明します。
ご参加お待ちしております。

例えば、このような方に・・・

「蛍光X線分析は知っていたが、マッピングができることは知らなかった！」

「混合物の元素分析をしたい！」

「濃度の勾配や分布を調べたい！」

もちろん、

「とりあえず、センターにどんな装置があるか知りたい！」

という方も歓迎します。お気軽にどうぞ。

日時：令和2年2月28日（金） PM1:30～3:00
場所：山梨県産業技術センター 研究管理棟2F 宝石物性測定室
内容：エネルギー分散型微小部蛍光エックス線分析装置による
マッピング測定
参加費：無 料

定員
5名

つきにご記入頂き、2月21日(金)までにfaxして下さい。電話、メールでも結構です。

貴社名			
住所	〒		
連絡先	TEL:	FAX:	
	E-Mail:		
受講者	氏名:	所属:	

●お申し込み先 **FAX** 055-243-6110 **E-Mail** yitc-kit01@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県産業技術センター 食品酒類・研磨宝飾技術部 研磨宝飾科 林、宮川

TEL:055-243-6111 [〒400-0055 甲府市大津町 2094]